

# DIFFRACTOMÈTRE DE RAYONS X (XRD)

---

FABRICANT : Philips

MODÈLE : X'Pert

---

## Échantillons

- Types : tous les matériaux cristallins (métaux, céramiques, matériaux inorganiques, composites, etc.) sous forme de poudre ou massique

## Analyses

- Identification de phases et composés
- Semi-quantitatif ou quantitatif (avec standard)

## Applications

- Mesure de stress
- Identification de phase
- Mesure en angle rasant

## Caractéristiques

- Deux détecteurs : méthode des poudres (Bragg-Breantano) et angle rasant
- Sources de rayon X interchangeables (Cu ou Co)